磷酸铁锂元素含量测定

磷酸铁锂与前驱体主量与杂质元素含量快速测定

应用概述

钴酸锂

三元材料

磷酸铁锂

锰酸锂

磷酸铁锂正极材料以其安全性和经济性，越来越受到重视。其前驱体为锂盐和磷酸铁，常用方法为固相合成法。磷酸铁前驱体中磷、铁含量及比例控制是产品质量的要素，磷酸铁锂中锂、铁、磷含量与摩尔比是锂离子电池性能的保证。

通常采用电感耦合等离子体发射光谱法（ICP）测定杂质元素含量；火焰光度法测定锂含量；钼酸喹啉称量法测定磷含量；重铬酸钾滴定法测定铁含量等。采用多种分析方法繁琐且耗时耗力，无法满足生产过程中实时质量控制需求。

代表 XRF 发展水平的单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪，可以同步分析磷酸铁锂材料中主量元素以及微量杂质。采用全谱拟合的全息基本参数法（Holospec FP 2.0），结合 HS XRF，可精确测定锂（Li）含量。同时具备制样简单、分析速度快、成本低等特点，为磷酸铁锂材料元素测定提供先进的解决方案。

方法原理

1) 硬件核心技术：单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪 (HS XRF®)

发明专利：ZL 2017 1 0285264.X

X 射线管出射谱经双曲面弯晶单色化聚焦入射样品，消除 X 射线管韧致辐射所产生的散射线背景，同时光路形成偏振消光光路，进一步降低单色化入射射线散射线背景。

聚焦激发，增加有限的 SDD 窗口面积接收样品元素荧光射线强度，实现对元素的高灵敏度检测。

2) 软件核心技术：全息基本参数法 (Holospec FP 2.0)

基本参数法 (FP: Fundamental Parameters method) 是 X 射线荧光领域的核心算法和研究重点。安科慧生研发人员历时十几年，颁布全息基本参数法-Holospec FP 2.0，将基本参数法的应用提升到前所未有的水平。

Holospec FP 与常规 FP 区别：

- 1) 全谱拟合：当前唯一采用全谱拟合的基本参数法
- 2) 完整性：基本参数库结合先进的数学模型 (Advanced MM)，从而完成对 XRF 整个物理学过程的数字化描述
- 3) 快速：CPU 多核并行运算结合 GPU 单元，采集谱图与海量运算同步完成
- 4) 可视化与支持用户开发：可视化图形界面与开放的参数设置

Holospec FP 功能与优势：

- 1) 通过精确计算消除 (或减少) XRF 物理学各种效应
- 2) 达到元素无标定量分析精度
- 3) 减少标准物质要求，快速建立 XRF 元素分析方法
- 4) 提升元素定量精度和扩展样品适应性

全息基本参数法 (Holospec FP 2.0)

1. 谱图

图 1：单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪磷酸铁谱图

说明：采用单色化激发技术，取得对轻元素（P 等）极佳的灵敏度与分辨率，是重复性精度的保证。

2. 重复性精度

表 1：磷酸铁重复性测试

样品名称	分析次数	Fe(%)	P(%)	O(%)	Fe/P 摩尔比
		Raw FP	Raw FP	Raw FP	
磷酸铁 101	1	36.39	20.65	42.68	0.9770
磷酸铁 101	2	36.37	20.66	42.69	0.9763
磷酸铁 101	3	36.32	20.67	42.72	0.9741
磷酸铁 101	4	36.36	20.66	42.70	0.9757
磷酸铁 101	5	36.37	20.66	42.70	0.9760
磷酸铁 101	6	36.37	20.66	42.69	0.9765
磷酸铁 101	7	36.38	20.66	42.69	0.9765
极差		0.068	0.020	0.040	0.003
SD		0.02	0.01	0.01	0.001
RSD		0.060%	0.035%	0.035%	0.094%

说明：磷酸铁前躯体，7 次平行制样，单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪 MERAK-SC 与 Holospec FP 2.0 测试，具备比化学法更佳的重复性精度。

表 2：磷酸铁锂重复测试结果

重复次数	Fe(%)	P(%)	Li(%)
	Raw FP	Raw FP	Raw FP
1	34.33	20.23	4.48
2	34.33	20.18	4.49
3	34.37	20.25	4.47
4	34.34	20.21	4.48
5	34.34	20.16	4.49
6	34.31	20.18	4.49
7	34.36	20.18	4.48
极差	0.062	0.089	0.022
RSD(%)	0.062	0.157	0.151

3. 准确性

表 3: 磷铁锂准确性对比结果

样品名称	Fe(%)		P(%)		Li(%)	
	化学值	HS XRF	化学值	HS XRF	化学值	HS XRF
磷酸铁锂(DT)	34.50	34.58	19.43	19.42	4.51	4.56
LFP	34.85	34.94	19.43	19.39	4.55	4.49

说明: 采用单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪与全息基本参数法, 与化学法对比, 均具有极佳的一致性, 锂元素相对偏差 < 0.05%。

优势特点

速度快

采用直接装杯压实或压片制样, 单个分析时间 3 分钟;

重复性精度高

Li RSD~0.3%; Ni\Co\Mn RSD 优于 0.2%;

准确度

采用经严苛定量同类型样品校正, Li 准确度偏差 < 0.03%;

元素分析范围宽

主量元素 (Li、Ni、Co、Mn、Al、P、Fe) 和杂质元素同步分析;

分析成本低

样品分析成本小于 10 元/个;

样品适应范围宽

从前驱体、正极材料到涂布层, 提供完整元素分析解决方案;

测试流程

A. 压片制样

B. 粉末压实制样

方案展示

台式机: PHECDA-HES

台式机: MERAK-SC

台式机: MEGREZ- α

保密声明: 安科慧生拥有单波长激发-能量色散 X 射线荧光光谱仪中国发明专利, 未经公司允许, 安科慧生官网资料, 不得转发或用于商业宣传。